



Title of Change:	5-inch Production line closure of ON Semiconductor Niigata Co., Ltd. (OSNC)	
Proposed first ship date:	27 February 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Tomohiro.Uda@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> <Hiroshi.Inoue@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Yasuhiro.Igarashi@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Date Code	
Change Category:	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other	
Change Sub-Category(s):	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Niigata, Japan	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
Fab (OSNC)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)
Equipment	5inch equipment	6inch equipment (Each function is the same)
Si Sub material	5inch wafer	6inch wafer (No change except wafer diameter)



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME STK672-440AN-E
PACKAGE: SIP-S

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	EIAJ ED-4701/100 Method 101	Ta= 125°C	1008 hrs	0/11
TC	EIAJ ED-4701/100 Method 105	Ta= -40°C to +125°C	1000 cyc	0/11
AC	EIAJ ED-4701 Method B-123	121°C, 100% RH, 15psig,	96 hrs	0/11
ESD(HBM)	ED-4701/300 Method 304	100pF,1.5kohm,V=2kV	-	0/3
ESD(MM)	-	200pF,V=200V	-	0/3

All reliability test passed.

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted

List of Affected Parts:

Part Number	Qualification Vehicle
STK672-630AN-E	STK672-440AN-E
STK672-632AN-E	
STK672-640AN-E	
STK672-642AN-E	
STK672-732AN-E	
STK672-740AN-E	
STK672-630CN-E	
STK672-640CN-E	
STK681-332-E	
STK672-430AN-E	
STK672-432AN-E	
STK672-440AN-E	
STK672-442AN-E	
STK672-432BN-E	
STK672-440BN-E	
STK672-442BN-E	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号: FPCN22135XA

発行日: 20 November 2018

変更件名:	オン・セミコンダクター新潟株式会社 (OSNC) の 5-インチ生産ラインの閉鎖													
初回出荷予定日:	27 February 2019													
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Tomohiro.Uda@onsemi.com> にお問い合わせください。													
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com> <Hiroshi.Inoue@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、今回の変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。													
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Yasuhiro.Igarashi@onsemi.com> にお問い合わせください。													
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> をお願いします。													
変更部品の識別:	日付コード													
変更カテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____													
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input checked="" type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____													
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: オン新潟(日本)	外部製造工場 / 下請け業者拠点: なし												
説明および目的:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製造 (OSNC)</td> <td>N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)</td> <td>N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)</td> </tr> <tr> <td>装置</td> <td>5 インチ装置</td> <td>6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)</td> </tr> <tr> <td>Si サブマテリアル</td> <td>5 インチ ウェハ</td> <td>6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)</td> </tr> </tbody> </table>			変更前の表記	変更後の表記	製造 (OSNC)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)	装置	5 インチ装置	6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)	Si サブマテリアル	5 インチ ウェハ	6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)
	変更前の表記	変更後の表記												
製造 (OSNC)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)												
装置	5 インチ装置	6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)												
Si サブマテリアル	5 インチ ウェハ	6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)												



信頼性データの要約:

QV 素子名: STK672-440AN-E

パッケージ: SIP-S

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	EIAJ ED-4701/100 Method 101	Ta= 125°C	1008 hrs	0/11
TC	EIAJ ED-4701/100 Method 105	Ta= -40°C to +125°C	1000 cyc	0/11
AC	EIAJ ED-4701 Method B-123	121°C, 100% RH, 15psig,	96 hrs	0/11
ESD(HBM)	ED-4701/300 Method 304	100pF,1.5kohm,V=2kV	-	0/3
ESD(MM)	-	200pF,V=200V	-	0/3

すべての信頼性テストが合格しました。

電気的特性の要約:

電気的特性は影響を受けません

影響を受ける部品の一覧:

部品番号	品質試験用ピークル
STK672-630AN-E	STK672-440AN-E
STK672-632AN-E	
STK672-640AN-E	
STK672-642AN-E	
STK672-732AN-E	
STK672-740AN-E	
STK672-630CN-E	
STK672-640CN-E	
STK681-332-E	
STK672-430AN-E	
STK672-432AN-E	
STK672-440AN-E	
STK672-442AN-E	
STK672-432BN-E	
STK672-440BN-E	
STK672-442BN-E	